



ИР - БАН

България, София 1113, ПК 79, ул. „Акад. Г. Бончев”, Бл. 2,

Изм. № 204/02.04.2019 г.

Тел. (+359 2) 8703361; Факс: (+359 2) 4053061

ДО

Участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИР-БАН, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Относно: Разяснения по постъпили въпроси от заинтересовано лице, както следва:

1. Поставен е въпрос как следва да се чете срока за отстраняване на дефекти в т. 3 от Образец № 3, тъй като в образца е посочено, че „отстраняването на дефектите е в срок от 3 /три/ работни/ дни, докато в документацията и договора срокът е 30 /тридесет/ работни дни?

2. Поставено е искане за разяснение относно техническите изисквания по Обособена позиция № 2 относно т. 1 „Интегрирана тестова система/анализатор на характеристиките на полупроводникови прибори“ като е посочено, че изискването „да бъде с модулна архитектура, позволяваща разширение“ не може да бъде изпълнено, тъй като техническата спецификация вече съдържа всички възможни разширения.

РАЗЯСНЕНИЯ:

1. Срокът за отстраняване на дефектите, посочен в т. 3 на Образец № 3 следва да се чете по следния начин:

„Гаранционният срок на доставеното оборудване е /...../ месеца, считано от дата на приемане на доставката с приемно-предавателен протокол. Технологичното оборудване ще е придружено с гаранционна карта.

Декларираме, че при повреда на оборудването ще осигурим отстраняването на дефектите в срок от 30 /тридесет/ работни дни“;

2. Техническата спецификация по Обособена позиция № 2 относно т. 1 „Интегрирана тестова система/анализатор на характеристиките на полупроводникови прибори“ е със следното съдържание:

„Интегрирана тестова система/анализатор на характеристиките на полупроводникови прибори

Система за определяне волт-амперни и волт-фарадни характеристики на полупроводникови прибори

Измерване на волт-амперни (I-V) характеристики – в базови и импулсни режими (spot, sweep, sampling и pulse): за обватите от 0.1 fA до 1 A и 0.5 μ V до 200

V

Максимални нива на сигналите за източника / измерителя: ≥ 200 V / 1A;

Минимални прагове на измерване: 0,1 fA / 0,5 μ V;

Измерване на волт-фарадни характеристики (C-V) с променлив ток за честоти от 1 kHz до ≥ 5 MHz и QS-CV измервания (Quasi-Static Capacitance-Voltage);

Да съдържа програмно осигуряване за автоматизация на процесите по измерване и характеризация, с библиотеки за различни полупроводникови прибори.

Да съдържа всички необходими компоненти и програмно осигуряване за извършване на автоматизирано измерване на посочените характеристики.

Да бъде с модулна архитектура, позволяваща разширение.

В комплектацията да бъдат включени нужните кабели и аксесоари за измерване и връзка с компютър.

В офериранията цена следва да бъде включена доставка, инсталация, тестване и обучение“.

С оглед поставеното запитване т. 1 „Интегрирана тестова система/анализатор на характеристиките на полупроводникови прибори“ следва да се чете по следния начин:

„Интегрирана тестова система/анализатор на характеристиките на полупроводникови прибори

Да бъде с модулна архитектура, позволяваща разширение:

Система за определяне волт-амперни и волт-фарадни характеристики на полупроводникови прибори;

Измерване на волт-амперни (I-V) характеристики – в базови и импулсни режими (spot, sweep, sampling и pulse): за обхватите от 0.1 fA до 1 A и 0.5 μ V до 200 V;

Максимални нива на сигналите за източника / измерителя: ≥ 200 V/ 1A;

Минимални прагове на измерване: 0,1 fA / 0,5 μ V;

Измерване на волт-фарадни характеристики (C-V) с променлив ток за честоти от 1 kHz до ≥ 5 MHz и QS-CV измервания (Quasi-Static Capacitance-Voltage);

Да съдържа програмно осигуряване за автоматизация на процесите по измерване и характеризация, с библиотеки за различни полупроводникови прибори.

Да съдържа всички необходими компоненти и програмно осигуряване за извършване на автоматизирано измерване на посочените характеристики.

В комплектацията да бъдат включени нужните кабели и аксесоари за измерване и връзка с компютър.

В офериранията цена следва да бъде включена доставка, инсталация, тестване и обучение“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ИР към БАН

Доц. Август Иванов

Заличен подпис

сл. 2 и сл. 23 от 33АА